WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

C01B 21/064, C23C 18/12 C01B 35/14, C04B 41/50

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 92/16456

A1 (43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

1. Oktober 1992 (01.10.92)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP92/00552

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. März 1992 (13.03.92)

(30) Prioritätsdaten:

P 41 08 367.9

15. März 1991 (15.03.91)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): ELEK-TROSCHMELZWERK KEMPTEN GMBH [DE/DEI: Hanns-Seidel-Platz 4, D-8000 München 83 (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHMID, Günter [DE/ DE]; Klippe 39 B, D-5620 Velbert 11 (DE). PIONTEK, Torsten [DE/DE]; Lindhorststraße 257, D-4250 Bottrop (74) Anwalt: FRANKE, Erich; Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-Platz 4, D-8000 München 83 (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), DK (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), GR (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), LU (europäisches Patent), MC (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), SE (europäisches Patent) sches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: METHOD FOR PREPARING BORON NITRIDE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON BORNITRID

(57) Abstract

The invention discloses a method for preparing boron nitride with a predominantly hexagonal structure by reacting lithium nitride with trifluoroborane dialkyletherate and heating the intermediate product of the formula (I): (BN), (BF₂), obtained to a temperature equal to or greater than 520 °C. In formula (I), x is a number between 3 and 7000, y is a number between 3 and 400 and the quotient x/y is a number between 1 and 18. The intermediate product of formula (I), which is also claimed, can be used to produce boron nitride coatings on metallic or ceramic surfaces.

(57) Zusammenfassung

Verfahren zur Herstellung von Bornitrid mit überwiegend hexagonaler Struktur durch Umsetzung von Lithiumnitrid mit Trifluorboran-dialkyletherat und Erhitzen des dabei erhaltenen Zwischenproduktes der Formel (I): (BN)_x(F)_y(BF₂)_y, wobei x einen Wert von 3 bis 7000, v einen Wert von 3 bis 400 und der Quotient x/y einen Wert von 1 bis 18 hat, auf eine Temperatur von > 520 °C. Das gleichfalls beanspruchte Zwischenprodukt der vorgenannten Formel kann zur Herstellung von Bornitrid-Schichten auf metallischen oder keramischen Oberflächen verwendet werden.

LEDIGIJCH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfhögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| AT AU BB BE BF BG BJ BR CA CF CG CH CI | Österreich Australien Barbados Belgien Burkina Faso Bulgarien Benin Brasilien Kanada Zentrale Afrikanische Republik Kongo Schweiz Cöte d'Ivoire | FI FR GA GB GN GR HU IE IT JP KP KR | Finnland Frankreich Gabon Vereinigtes königreich Guinea Griechenland Ungarn Irland Italien Japan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea | MN MR MW NL NO PL RO RU SD SE SN SU TG | Mongolei Mauritanien Malawi Niederlande Norwegen Polen Rumänien Russische Föderation Sudan Schweden Senegal Soviet Union Tischad Togo |
|--|---|--|---|--|---|
| CG | Kongo | | | | Soviet Union |
| | | | • | | |
| CS DE+ DK | Tschechoslowakei Deutschland Dänemark | LU MC MG | Luxemburg Monaco Madagaskar | us | Vereingle Smaller (Vereingle) |
| FS | Sacratea | Ml | Mali | | |

ES

Spanien

Verfahren zur Herstellung von Bornitrid

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Bornitrid mit überwiegend hexagonaler Struktur sowie ein Zwischenprodukt zur Herstellung des Bornitrids und die Verwendung dieses Zwischenproduktes zur Herstellung von Bornitrid-Schichten auf metallischen oder keramischen Oberflächen.

Dünne zusammenhängende Schichten (Filme) aus Nichtoxidkeramiken auf Oberflächen von Werkstoffen aller Art finden in zunehmendem Maße technisches Interesse. Die Keramikfilme verhindern eine Zerstörung der Werkstoffoberfläche, sei es durch Luftsauerstoff bei gleichzeitiger thermischer Beanspruchung, durch ätzende oder korrodierende Chemikalien oder durch Abrieb bei hoher mechanischer Beanspruchung.

Insbesondere Bornitrid zeichnet sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Es wird in oxidierender Atmosphäre erst bei Temperaturen um 1000°C angegriffen. Außerdem leitet Bornitrid den elektrischen Strom nicht und besitzt einen sehr hohen spezifischen Widerstand.

Für die Herstellung von Bornitrid-Filmen sind aus dem Stand der Technik zahlreiche, jedoch meist sehr energieintensive und apparativ aufwendige Methoden bekannt:

- a) "Sputter deposition" (rf-sputtering)
 Das Verfahren wird benutzt, wenn eine der Edukt-Komponenten flüchtig ist. Die Phasenbildung verläuft kinetisch kontrolliert, wodurch es möglich ist, auf unbeheizte Oberflächen hochschmelzende Filme aufzubringen. Bei diesem Verfahren wird zur Bornitrid-Film-Herstellung zwischen zwei Elektroden, wobei an der Anode das Substrat und an der Kathode die Borquelle angebracht ist, ein Stickstoffplasma erzeugt.
 Durch die sehr hohe negative Spannung, die an der Kathode angelegt wird, wird ein Stickstoffionenstrom erzeugt, der aus der Borquelle Bor- oder Bornitrid-Moleküle herauszuschlagen imstande ist. Diese dann ungeladenen Moleküle kondensieren auf der Substratoberfläche zu einem Bornitrid-Film.
- b) "Physical vapor deposition" (PVD)
 Bei einem Druck von 10⁻⁴ Pa wird auf einem Substrat durch
 Elektronenstrahlbeschuß ein Bor-Film von 100 bis 200 nm
 Dicke aufgebracht. Dieser Bor-Film wird anschließend mit 100
 keV Stickstoffionen mit einer Strahlungsdichte von 6x10¹⁷
 Ionen/cm² beschossen, wobei sich aus dem Bor-Film ein Bornitrid-Film bildet.
- c) "Reactive ion beam assisted deposition" (RIBAD)
 Es handelt sich dabei um eine Methode, bei der simultan oder sequentiell Substratoberflächen mit Bor beschichtet oder in borbeschichtete Oberflächen Stickstoffionen implantiert werden. Durch diese Methode ist es möglich, Filme größerer Dicke zu erhalten.
- d) "Dynamic mixing" (IVD)
 Bei dieser gemischten Methode wird gleichzeitig ein Ionenstrahl des einen Elementes erzeugt und die zweite Komponente
 verdampft. Bornitrid-Filme werden durch Verdampfen von Bor

und gleichzeitiger Erzeugung eines Stickstoffionenstrahls mit einer Energie von 200 eV bis 40 keV hergestellt.

- e) "Direct ion beam deposition"
 Mit Hilfe eines Primär-Elektronen-Strahls wird aus einem
 Borazin-Plasma (B₃N₃H₆) ein Ionenstrahl erzeugt, der auf
 eine Substratoberfläche fokussiert wird und so einen Bornitrid-Film bildet.
- f) "Chemical vapor deposition" (CVD)
 In der Gasphase reagieren zwei oder mehr Edukt-Komponenten,
 wobei sich unter Bildung von flüchtigen Nebenprodukten auf
 einem in den Gasraum eingebrachten Substrat ein Film bildet.
 Bornitrid-Filme durch CVD werden z.B. aus einem Gemisch
 BCl3-N2-H2-Ar erhalten. Von dieser Methode gibt es noch
 mehrere Abwandlungen.

Eine ausführliche Schilderung dieses Standes der Technik kann dem Buch "Synthesis and Properties of Boron Nitride" von John J. Pouch and Samuel A. Alterovitz, Verlag Trans Tech Publications, entnommen werden.

Die vorliegende Erfindung befaßt sich mit dem Problem der möglichst einfachen Herstellung von Bornitrid und Bornitrid-Filmen auf metallischen oder keramischen Oberflächen, wobei das Bornitrid überwiegend in hexagonaler Form vorliegen soll. Der Erfindung liegt dabei insbesondere das Problem zugrunde, eine Zwischenverbindung zu finden, die leicht herstellbar und sicher handhabbar ist und, gegebenenfalls direkt auf Oberflächen unter Filmbildung, unter möglichst schonenden Bedingungen ohne größeren apparativen Aufwand in Bornitrid umgewandelt werden kann.

Die Erfindung betrifft in einer ersten Ausgestaltung ein Verfahren mit dem Kennzeichen, daß man

- a) Lithiumnitrid in Form einer Suspension in wasserfreiem Dialkylether, dessen Alkylreste 2 bis 6 Kohlenstoffatome aufweisen, mit einem Überschuß an Trifluorboran-dialkyletherat, dessen Alkylreste 1 bis 6 Kohlenstoffatome aufweisen, unter Rühren in einem Temperaturbereich von 20 bis 230°C 2 bis 24 Stunden umsetzt,
- b) das erhaltene Zwischenprodukt der allgemeinen durchschnittlichen Formel

$$(BN)_{x}(F)_{y}(BF_{2})_{y}$$
,

wobei x einen Wert von 3 bis 7000,
y einen Wert von 3 bis 400 und
der Quotient x/y einen Wert von 1 bis 18 hat,

aus dem Reaktionsgemisch entfernt, noch im Reaktionsprodukt enthaltenes Trifluorboran-dialkyletherat und das als Neben-produkt entstandene Lithiumtetrafluoroborat mit einem geeigneten Lösungsmittel auswäscht und dann

c) das Zwischenprodukt der Formel I durch Erhitzen auf eine Temperatur von \geq 520°C in Bornitrid umwandelt.

In dem Verfahrensschritt a) verwendet man als Reaktionsmedium wasserfreien Dialkylether, dessen Alkylreste 2 bis 6
Kohlenstoffatome aufweisen, insbesondere Di-n-butylether.
Die Alkylreste können aber z.B. auch Ethyl-, Propyl- oder
Hexylreste sein. Der Ether kann auch ein gemischter Ether,
wie z.B. der n-Propyl-n-butylether, sein. Der Di-n-butylether ist aufgrund seines Siedepunktes von 140°C bevorzugt.
Sein Siedepunkt liegt somit im beanspruchten Bereich von 20
bis 230°C, so daß man die Reaktion unter Rückfluß vornehmen
kann.

Als Trifluorboran-dialkyletherate werden Verbindungen eingesetzt, die 1 bis 6 Kohlenstoffatome im Alkylrest aufweisen. Insbesondere bevorzugt ist Trifluorboran-dibutyletherat. Man verwendet für die Umsetzung einen Überschuß an Trifluorboran-dialkyletherat (bezogen auf Lithiumnitrid). Bevorzugt ist ein 4- bis 6facher Überschuß and Trifluorboran-dialkyletherat.

Im Verlauf der Umsetzung verschwindet die rote Farbe des Lithiumnitrids vollständig. Es entsteht ein farbloses Produkt, das als Nebenprodukt Lithiumtetrafluoroborat enthält. Der Feststoff wird vom flüssigen Reaktionsmedium durch Filtrieren, Dekantieren, Zentrifugieren oder andere bekannte Methoden zum Abtrennen von Feststoffen aus Flüssigkeiten abgetrennt.

In der Stufe b) wird das als Nebenprodukt entstandene Lithiumtetrafluoroborat mit einem geeigneten Lösungsmittel, vorzugsweise Tetrahydrofuran, ausgewaschen. Das ausgewaschene Zwischenprodukt wird anschließend von angelagertem Tetrahydrofuran vorzugsweise durch Erhitzen auf 200 bis 280°C befreit.

Man erhält das Zwischenprodukt der Formel I, welches in der Verfahrensstufe c) durch Erhitzen auf eine Temperatur von ≥ 520°C in Bornitrid umgewandelt wird. Diese Umwandlung erfolgt vorzugsweise unter Schutzgasatmosphäre oder im Vakuum. Erhitzt man das Zwischenprodukt unter Sauerstoffzutritt, erhält man sauerstoffhaltiges Bornitrid, welches eine hohe Härte (Mohs-Härte 7 bis 8) aufweist. Je schneller die Erhitzung und damit die Umwandlung des Zwischenproduktes erfolgt, um so größer sind die amorphen Anteile im erhaltenen Bornitrid, wie dies durch Debye-Scherrer-Aufnahmen leicht nachgewiesen werden kann.

Das Zwischenprodukt I, welches einen weiteren Gegenstand der Erfindung bildet, entspricht der durchschnittlichen allgemeinen Formel

 $(BN)_{x}(F)_{y}(BF_{2})_{y}$,

wobei x einen Wert von 3 bis 7000,
y einen Wert von 3 bis 400 und
der Quotient x/y einen Wert von 1 bis 18 hat.

Bevorzugte Bereiche für x sind 2000 bis 7000, bevorzugte Bereiche für y sind 200 bis 400 und bevorzugte Bereiche für den Quotienten x/y sind 10:1 bis 18:1.

Das Zwischenprodukt ist ein feines, weißes Pulver. Es weist im Debye-Scherrer-Diagramm sehr breite Reflexe bei 2 θ = 26,5° und 2 θ = 42,5° auf, welche durch die geringe Teil-chengröße des Pulvers bedingt sind. Eine DSC-Aufnahme der Verbindung zeigt, falls noch kleine restliche Mengen Tetrahydrofuran im Produkt enthalten sind, ein bei 220°C beginnendes exothermes Signal. Bei 520°C tritt ein weiteres, stark exothermes Signal auf, welches durch die beginnende Trifluorboranabspaltung verursacht wird.

Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen Zwischenverbindung I besteht in ihrer leichten Handhabbarkeit und in ihrer verhältnismäßig einfachen Herstellung. Das Zwischenprodukt kann auf Oberflächen von Metallen oder Keramiken aufgebracht und somit an Ort und Stelle in Bornitrid überführt werden. Dabei spielt die Form und Größe der zu vergütenden Oberfläche keine entscheidende Rolle. Es wird lediglich ein geeigneter, gegebenenfalls evakuierbarer oder mit Inertgas beauf-

ં દ

schlagbarer und auf Temperaturen von \geq 500°C beheizbarer Glühofen benötigt.

Das erfindungsgemäße Zwischenprodukt ist somit ein depotfähiger, lagerstabiler und leicht auf Oberflächen aufbringbarer Bornitrid-Vorläufer.

Die Erfindung betrifft deshalb als weiteren Gegenstand die Verwendung des Zwischenproduktes der Formel I zum Herstellen von Bornitrid-Schichten auf metallischen oder keramischen Oberflächen, wie z.B. Oberflächen aus Al₂O₃, TiO₂, MgO, SiC, Si₃N₄, B₄C, Mischkeramiken, Metallen und Edelmetallen.

Die zu beschichtenden Teile werden vorteilhafterweise im Rahmen einer Vorbehandlung entfettet. Die Beschichtung selbst wird durch Auftragen einer Dispersion des Zwischenprodukts I beispielsweise durch Sprühen, Streichen oder Tauchen vorgenommen. Als Dispergiermedien zur Herstellung der Dispersion des Zwischenprodukts I werden bevorzugt weitgehend wasserfreie Lösungsmittel wie Toluol, Ether, Alkene und/oder aromatische Kohlenwasserstoffe eingesetzt.

Die derart beschichteten Teile werden anschließend für einen Zeitraum von 1 bis 5 h auf eine Temperatur ≥ 520°C erhitzt. Die erfindungsgemäß beschichteten Teile eignen sich bevorzugt als Gleit- und Lagerelemente.

Die Erfindung soll durch die folgenden Beispiele noch näher erläutert werden.

1. Beispiel

Zu einer Suspension von 5,0 g (144 mMol) Lithiumnitrid in 150 ml absolutiertem Di-n-butylether gibt man langsam den

fünffachen Überschuß (150 ml \approx 144,7 g \approx 730 mMol) an Trifluorboran-dibutyletherat:

 $\text{Li}_3\text{N+5BF}_3 \cdot \text{OBu}_2 \rightarrow \text{(BN)}_{6000\pm400} \text{(F)}_{350\pm20} \text{(BF}_2)_{350\pm20} + 3\text{LiBF}_4 + 5\text{Bu}_2\text{O}$

Unter Rühren erhitzt man die Suspension ca. 6 h lang unter Rückfluß. Hierbei verschwindet die rote Farbe des Lithium-nitrids vollständig. Es entsteht ein farbloses Produkt. Der Feststoff wird abgefrittet und mit absolutiertem Diethylether mehrfach gewaschen, um anhaftendes Trifluorboran-dibutyletherat zu entfernen. Anschließend wird der Feststoff im Vakuum getrocknet.

Das Produktgemisch wird zum Entfernen des LiBF4 mit absolutiertem Tetrahydrofuran versetzt und ca. 2 h gerührt. Der verbleibende Feststoff wird abgefrittet und mit absolutiertem Diethylether gewaschen und anschließend im Vakuum getrocknet. Das erhaltene Zwischenprodukt der Formel

(BN) 6000±400 (F) 350±20 (BF₂) 350±20

wird nun unter Schutzgas bei 250°C von angelagertem Tetrahydrofuran befreit.

Das erhaltene Zwischenprodukt (f-BN) wird durch langsames Erhitzen auf 1100°C in Schutzgasatmosphäre unter Abspalten von Trifluorboran zu hexagonalem BN (h-BN) umgewandelt.

Durch schlagartiges Erhitzen auf 1100°C läßt es sich zu einem Bornitrid kondensieren, welches in Debye-Scherrer-Aufnahmen die Reflexe von h-BN aufweist. Diese sind jedoch stark verbreitert, was auf große amorphe Bereiche hindeutet.

Erhitzen an Luft auf 1100°C führt zu einem sehr harten Material (Mohs-Härte 7 bis 8), das aber große Mengen Sauerstoff beinhaltet.

Das Zwischenprodukt (f-BN) zeigt in einer DSC-Aufnahme einen sehr breiten Reflex bei 2 θ = 26,5° (002) und einen sehr breiten Reflex bei 2 θ = 42° (100, 101), was auf ein dreidimensional ungeordnetes Bornitrid schließen läßt, bei dem zwar bereits die Schichten in einer gewissen Größe ausgebildet sind, die dreidimensionale Zusammenlagerung zu h-BN oder r-BN jedoch noch nicht erfolgt ist.

2. Beispiel

Das nach Beispiel 1 erhaltene Zwischenprodukt (f-BN) wird mit trockenem Toluol zu einer 10%igen Suspension dispergiert und in einer Glovebox auf die Gleitflächen eines SiC-Gleitrings durch Sprühen gleichmäßig aufgetragen. Das noch feuchte Teil wird in einen Ofen gebracht und mit N2 gespült. Durch langsames Erhitzen innerhalb von 60 Min. auf 200°C wird das Lösemittel vertrieben. Danach wird die Temperatur innerhalb 5 Std. kontinuierlich auf 1100°C erhöht. Die Beschichtung wird dabei in h-BN umgewandelt. Im Anwendungstest wird am erfindungsgemäß beschichteten SiC-Gleitring gegenüber einem nicht beschichteten SiC-Gleitring ein um 50% niedrigerer Reibungskoeffizient gemessen.

Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von Bornitrid mit überwiegend hexagonaler Struktur, dadurch gekennzeichnet, daß man
 - a) Lithiumnitrid in Form einer Suspension in wasserfreiem Dialkylether, dessen Alkylreste 2 bis 6 Kohlenstoffatome aufweisen, mit einem Überschuß an Trifluorborandialkyletherat, dessen Alkylreste 1 bis 6 Kohlenstoffatome aufweisen, unter Rühren in einem Temperaturbereich von 20 bis 230°C 2 bis 24 Stunden umsetzt,
 - b) das erhaltene Zwischenprodukt der allgemeinen durchschnittlichen Formel

$$(BN)_{x}(F)_{y}(BF_{2})_{y}$$
,

wobei x einen Wert von 3 bis 7000,
 y einen Wert von 3 bis 400 und
 der Quotient x/y einen Wert von 1 bis 18 hat,

aus dem Reaktionsgemisch entfernt, noch im Reaktionsprodukt enthaltenes Trifluorboran-dialkyletherat und das als Nebenprodukt entstandene Lithiumtetrafluoroborat mit einem geeigneten Lösungsmittel auswäscht und dann

- c) das Zwischenprodukt der Formel I durch Erhitzen auf eine Temperatur \geq 520°C in Bornitrid umwandelt.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man in der Verfahrensstufe a) als Trifluorboran-dialkyletherat Trifluorboran-dibutyletherat verwendet.

- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man in der Verfahrensstufe b) das Lithiumtetrafluoro-borat mit Tetrahydrofuran auswäscht und das gereinigte Zwischenprodukt der Formel I nach dem Auswaschen durch Erhitzen auf eine Temperatur von 200 bis 280°C von angelagertem Tetrahydrofuran befreit.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man in der Verfahrensstufe c) die Umwandlung des Zwischenproduktes I in Bornitrid unter Schutzgasatmosphäre oder im Vakuum durchführt.
- 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gkennzeichnet, daß man in der Verfahrensstufe c) die Umwandlung des Zwischenproduktes I in Bornitrid unter Sauerstoffzutritt durchführt.
- 6. Verbindung der allgemeinen Formel

$$(BN)_{x}(F)_{y}(BF_{2})_{y}$$

wobei x einen Wert von 3 bis 7000,
y einen Wert von 3 bis 400 und
der Quotient x/y einen Wert von 1 bis 18 hat.

- 7. Verwendung der Verbindung des Anspruchs 6 zum Herstellen von Bornitrid-Schichten auf metallischen oder keramischen Oberflächen.
- 8. Verfahren zur Herstellung von BN-Schichten auf metallischen oder keramischen Oberflächen, gekennzeichnet dadurch, daß eine Verbindung nach Anspruch 6 in einem Lösemittel dispergiert, auf die zu beschichtende Oberfläche aufgetragen und unter Schutzgas auf ≥ 520°C erhitzt wird.

9. Verwendung von nach Anspruch 8 beschichteten Teilen als Gleit- und/oder Lagerelement.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 92/00552

| I. CLASSIF | ICATION OF SUBJECT MATTER (If several classifi | ication symbols apply, indicate all) 8 | |
|--|--|--|--|
| According to Int.Cl. | Sternational Patent Classification (IEC) of to poth Nation (23C18/12; | CO 1835/14; and CO4841/50 | |
| ii. FIELDS | SEARCHED | | |
| | Minimum Documen | | |
| Classification | System (| Classification Symbols | |
| Int.Cl. | 5 CO1B; C23C; C04B | | |
| | Documentation Searched other to to the Extent that such Documents | nan Minimum Documentation are Included in the Fields Searched ⁸ | |
| | | | |
| | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT® Citation of Document, 11 with Indication, where appr | contists, of the relevant passages 12 | Relevant to Claim No. 13 |
| A A | WO,A,8802003 (SRI INTERNATION see example 5 | | 1-9 |
| A | US,A,4971779 (R.T. PAINE ET see column 5, line 43 - | 1-9 | |
| A | CHEMICAL ABSTRACTS, Vol.110, 29 May 1989, Columbus, O Abstract No. 195814P, page 170; see abstract ⅅ,A,259148 AKADEMIE DE DDR) 17 August 1988. | 1 | |
| | · | - | |
| | · ·- ·- | | |
| "A" docum consider filling of the critation of the critat | categories of cited documents: 10 ment defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance r document but published on or after the international date ment which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ment published prior to the international filing date but than the priority date claimed | "T" later document published after or priority date and not in conficited to understand the princip invention "X" document of particular relevant cannot be considered novel of involve an inventive step "Y" document of particular relevant cannot be considered to involve document is combined with one ments, such combination being in the art. "&" document member of the same | ict with the application but le or theory underlying the ce; the claimed invention cannot be considered to ice; the claimed invention an inventive step when the or more other such docu- obvious to a person skilled |
| IV. CERTIF | ICATION | | |
| Date of the | Actual Completion of the International Search | Date of Mailing of this International S | |
| 16 Jı | une 1992 (16.06.92) | 26 June 1992 (26 | .06.92) |
| International | Searching Authority | Signature of Authorized Officer | |
| FIIRO | PEAN PATENT OFFICE | | • |

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO. SA 57214

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report.

The members are as contained in the European Patent Office EDP file on

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information. 16/06/92

| Patent document cited in search report | Publication date 24-03-88 | P | Publication date | |
|---|---|---|--|--|
| WO-A-8802003 | | US-A- EP-A,B GB-A- JP-T- NL-T- US-A- | 4801439 0282561 2205563 1500832 8720501 5017529 | 31-01-89 21-09-88 14-12-88 23-03-89 01-08-88 21-05-91 |
| US-A-4971779 | 20-11-90 | US-A- | 5082693 | 21-01-92 |
| DD-A-259148 | w p d a a a a a a a a a a a a a a a a a | None | | |

PCT/EP 92/00552

| | | ELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehr Jassifikation (IPC) oder mach der mations | eren Klassifikationssymbolen sind alle anzug | :Den)* |
|--|--|---|--|--|
| | 5 CO1B21/0 | | C01B35/14; | C04B41/50 |
| II. RECHERO | HIERTE SACHGE | | Mindered Service 2 | |
| | | Kacherchierte | er Mindestprüfstoff 7 | |
| Klassifikatio | acsytem | | Klassifikationssymbole | |
| Int.K1. | 5 | CO1B; C23C; | C04B | |
| | | Recherchierte nicht zum Mindestprüfsto unter die recherchi | ff gehörende Veröffentlichungen, soweit dies erten Sachgebiete fallen ⁸ | • |
| | | | | |
| III. EINSCHI | AGIGE VEROFFE | NTLICHUNGEN ⁹ | | |
| Art." | Emezeichnung der | Veröffentlichung 11 , soweit erforderlich | unter Angabe der maßgeblichen Teile ¹² | Betr. Anspruch Nr. 13 |
| A | | BO2 OO3 (SRI INTERNAT) | IONAL) 24. März 1988 | 1-9 |
| A | 1990 | 971 779 (R.T. PAINE ET palte 5, Zeile 43 - Ze | • | 1-9 |
| A | 29. Mai abstract Seite 17 siehe Zi & DD,A,2 | L ABSTRACTS, vol. 110, 1989, Columbus, Ohio, t no. 195814P, 70; usammenfassung 259 148 (AKADEMIE DER . August 1988 | , US; | 1 |
| | | | | • |
| "A" Vertidefinis "E" ältere "L" Vertidefinis "L" Vertidefinis nannt ander "O" Vertidefinis bezide "P" Vertidefinis | Tentlichung, die den lert, aber nicht als be s Dokument, das jed len Anneldedatum wit fentlichung, die gest changtatum einer at changtatum einer at en Veröffentlichung en besonderen Grune ffentlichung, die sich Bentung, eine Aus kt | gegebenen Veröffentlickungen 10 : allgemeinen Stand der Technik istonders bedeutsam anzusehen ist soch erst am oder nach dem interna- eröffentlicht werden ist gnet ist, einen Frioritätsanspruch assen, oder durch die das Veröf- nderen im Recherchenbericht ge- belegt werden soll oder die aus einem i angegeben ist (wie ausgefunt) auf eine sundliche Offenbarung, stellung oder andere Maßnahmen dem internationalen Anneldeda- spruchten Prioritätsdatum veröffent- | "T" Spätere Veröffentlichung, die nach meidelatum oder dem Frioritätsda ist und mit der Annacidung nicht is Verständnis des der Erfindung zug oder der ihr zugrundeliegenden Th "X" Veröffentlichung von besonderer B to Erfindung kann nicht als neu od kalt beruhend betrachtst werden "Y" Veröffentlichung von besonderer B to Erfindung kann nicht als auf er ruhend betrachtst werden, wenn di einer oder menreren anderen Veröfgorie in Verbindung gebracht wird einen Fachmann naheliegend ist "A" Veröffentlichung, die Mitglied der | um veröffentlicht worden oliidiert, soedern nur zum rundeliegenden Prinzips sorie angegeben ist steutung; die beanspruch- ier zuf erfinderischer Tätig- seleutung; die beanspruch- inderischer Tätigkeit be- s Veröffentlichung zuit fentlichungen dieser Kate- und diese Verbindung für |
| IV. BESCHE | INIGUNG | | | i |
| Datum des Ab | schlusses der interna 16. d | utionalen Racherche JUNI 1992 | Absendedatum des internationalen | Recherchenherichts 2 6 JUN 1992 |
| Internationale | Recherchenbehörde | | Unterschrift des bevollmachtigten E | esiensteten |
| | EUROPA | SCHES PATENTAMT | Unterschrift des bevollmachtigten B REEDIJK A.M.E. | Lechh |

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

9200552 57214 SA

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Pratentdokumente angegeben. Die Anzaben über die Pamilienmitstieder entemperhen dem Stand des Pratei des Bengelichten

16/06/92

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentilokument | Datum der Veröffentlichung | Mit P | glied(er) der stentfamilie | Dutum der Veröffentlichung |
|---|-------------------------------|--|--|--|
| ₩0-A-8802003 , | 24-03-88 | US-A- EP-A, B GB-A- JP-T- NL-T- US-A- | 4801439 0282561 2205563 1500832 8720501 5017529 | 31-01-89 21-09-88 14-12-88 23-03-89 01-08-88 21-05-91 |
| US-A-4971779 | 20-11-90 | US-A- | 5082693 | 21-01-92 |
| DD-A-259148 | | Keine | , a a a a a a a a a a a a a a a a a a a | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | • | |